序号	货物名称	技术参数	数量	单位
1	扫描W探针显微镜	 1) 微波控制系统 ▲1. 微波输出频段: 0.7~4.0 GHz ▲2. 微波输出频率: ≥10 W 3. 微波频率精度: ≤0.01 Hz 4. 微波源功率精度: ≤0.5 dB 2) 共聚焦系统 1. 激光中心波长: 520±10 nm 2. 激光功率: ≥10 mW 3. 激光开关比: ≥50 dB 4. 纳米台扫描范围 (300 K): ≥40 μm × 40 μm × 40 μm 5. 纳米台分辨率 (300 K): ≤1 nm 6. 微米台移动范围 (300 K): ≥4 mm × 4 mm× 3 mm 7. 微米台分辨率 (300 K): ≤1 μm 8. 纳米台扫描范围 (4 K): ≥10 μm × 10 μm × 10 μm 9. 纳米台分辨率 (4 K): ≤1 nm 10. 微米台移动范围 (4 K): ≥4 mm × 4 mm × 3 mm 11. 微米台分辨率 (4 K): ≤1 μm 12. 荧光收集: 650 nm ~1060 nm (典型值) 13. 探测器: 单光子探测器 14. 探测效率: ≥65%@650 nm 15. 物镜数值孔径: ≥0.60 16. 物镜倍数: 40x 17. 物镜工作距离: ≥4.0 mm 3) 脉冲控制系统 ▲1. 时序精度: ≤1 ns 2. 最小脉宽: ≤7.5 ns 	1	台

- 3. 最大脉宽: ≥2s
- 4. 通道数: ≥8个
- ▲5. 脉冲个数: ≥106
- 6. 输出电平: 3.3 V±1%
- 4) NV 扫描探针系统
- ▲1. 金刚石探针数量: ≥2根
- 2. 每根探针 NV 色心数量: ≥3 个
- 3. 纳米扫描台范围(300 K): ≥40 μm×40 μm×40 μm×
- 4. 纳米台分辨率 (300 K): ≤1 nm
- 5. 微米台移动范围 (300 K): ≥4mm×4mm×3mm
- 6. 微米台分辨率 (300 K): ≤1 μm
- 纳米扫描台范围 (4 K): ≥10μm × 10 μm ×
 μm
- 8. 纳米台分辨率 (4 K): ≤1 nm
- 9. 微米台移动范围 (4 K): ≥4 mm × 4 mm × 3 mm
- 10. 微米台分辨率 (4 K): ≤1 μm
- ▲11. 磁灵敏度: ≤5 μT/sqrt(Hz)
- 12. 磁成像分辨率: ≤30 nm
- 5) 控制软件

单等高线磁成像、双等高线磁成像、连续波谱成像、荧光扫描成像、原子力显微镜成像、磁力显微镜成像、共聚焦成像、光探测磁共振谱测量。

- 6) 干式低震动无液氦低温矢量超导磁体系统
- 1. 磁场强度: 9/1/1 T 三轴磁体系统(Z 方向≥
- 9T, 其他任意方向≥1T)
- 2. 孔径: ≥2.5 英寸
- 3. Z 方向磁场均匀性: ±0.1%@10mmDSV
- 4. Y 方向磁场均匀性: ±1.0%@10mmDSV
- 5. X 方向磁场均匀性: ±1.0%@10mmDSV
- 6. 四象限双极性电流源×3 台, ≥2kW、具备自

动失超探测和保护功能,真空泵车:真空度 ≤10-6mbar

- 7. 低温系统:
- 7.1 样品最低温度: ≤3 K;
- 7.2 变温范围: 最低温度~室温;
- 7.3 制冷机: 4.2 K 分离阀脉管制冷机;
- 7.4 制冷功率: 1.5W @ 4.2 K (二级冷头)
- 7.5 冷却循环水: 6~9 L/min @ 5~25 ℃;
- 7.6 温控: 高精度 PID 控温仪: ±50 mK @ <77
- K, ± 100 mK @ >77 K $_{\circ}$
- 8. 减震平台: 主动减震平台, 减振效果: ≤100
- nm @ 1~5 Hz; \leq 1~100 nm @ 5~20 Hz; \leq 1 nm
- @ 20~200 Hz
- 9. 插杆升降平移系统: X-Z 高精度伺服控制系
- 统: 竖直 Z 方向行程≥1000nm, 水平 XY 方向
- 行程≥800nm